

СОДЕРЖАНИЕ

Том 38, номер 1, 2009

Введение к циклу статей по методам и средствам оценки и прогнозирования радиационной стойкости субмикронных изделий микроэлектроники 3

Моделирование и анализ радиационных эффектов в микроэлектронных изделиях

Экспериментальные исследования адекватности лазерного имитационного моделирования объемных ионизационных эффектов в интегральных схемах и полупроводниковых приборах

А. Ю. Никифоров, П. К. Скоробогатов, А. И. Чумаков, А. В. Киргизова, А. Г. Петров, П. П. Куцько, А. В. Кузьмин, А. А. Борисов, В. А. Телец, В. Т. Пунин, В. С. Фигуров 4

Расчет тока поверхностной рекомбинации в биполярных микроэлектронных структурах при воздействии ионизирующего излучения

В. С. Першенков, Д. В. Савченков, А. С. Бакеренков, А. С. Егоров 21

Функционально-логическое моделирование качества функционирования ИС при воздействии радиационных и электромагнитных излучений

В. М. Барбашов, Н. С. Трушкин 34

Перспективы использования субмикронных КМОП СБИС в сбоеустойчивой аппаратуре, работающей под воздействием атмосферных нейтронов

В. Б. Бетелин, С. В. Баранов, С. Г. Бобков, А. А. Краснюк, П. Н. Осипенко, В. Я. Стенин, И. Г. Черкасов, А. И. Чумаков, А. В. Яненко 48

Анализ работоспособности субмикронных КМОП СБИС ОЗУ при экстремальных тепловых режимах

А. А. Краснюк, В. Я. Стенин, И. Г. Черкасов, А. В. Яковлев 53

Особенности стимулированного излучением пробоя p - n -перехода с неоднородным легированием

А. С. Пузанов, С. В. Оболенский 64

Уважаемые авторы 75

Авторский указатель тома 37, 2008 г. 78
